飛騨天文台ドームレス太陽望遠鏡 偏光観測



第40回天文·天体物理若手夏の学校 2010年8月4日 in 豊橋 京都大学 阿南 徹

偏光

- 電場(磁場)の振動方向に偏りのある光 無偏光、楕円(円)偏光、直線偏光
- ・光源や媒質内の物理的異方性によって生じる

– ゼーマン効果	:	磁場

- ハンレ効果(散乱偏光) : 磁場
- スタルク効果 : 電場
- 衝突偏光 : 非熱的粒子
- Stokesベクトル(I,Q,U,V)で強度として記述可能

U = / - / $V = \bigcirc - \bigcirc$ view towards the sun

偏光観測システム

- 望遠鏡
 - 口径
 - 光学系
- 偏光解析装置
 - 回転波長板
 - 可変遅延素子
- 分光器 or フィルター => 波長帯、波長分解能
- 検出器(カメラ)
- データ処理装置



偏光解析装置

- 直線遅延素子(波長板)
 - 直線偏光の向きによって光の位相速度が異なる



太陽偏光観測これまで

- 偏光度(偏光強度/I)
 - 光球 ~10-1%
 - 彩層・コロナ <0.1%
- 偏光プラズマ診断
 - ゼーマン効果(磁場)
 - 光球 : 詳細に研究されている
 - 彩層: 偏光解釈にはハンレ効果が必要



- コロナ : Lin et al. 2000など数例しか行われていない
- ハンレ効果(彩層磁場)
 - ・ 偏光物理の理論的解釈や装置性能の進歩によって彩層磁場測定が 近年可能になり始めた(Bueno et al. 2002; Ramos et al. 2008)
- スタルク効果(電場)
- 衝突偏光(比熱的粒子)
- 飛騨天文台ドームレス太陽望遠鏡(DST)
 - - 既設の偏光解析装置(Kiyohara et al. 2004)
 光球スペクトル線(630nm) 偏光精度:0.17%

DST偏光観測

• [目的]

- スタルク効果や衝突偏光も含めた 新しいプラズマ診断手法の開発

- 太陽プラズマ現象のメカニズム解明

- [開発目標]
 - 広波長域 : 可視~近赤外(380~1100nm)
 - 多波長同時 :光球・彩層スペクトル線
 - 高偏光精度 : 10-4
- [方法]
 - 偏光精度の向上 <= 既設の偏光解析装置の改良
 多波長観測 <= 装置偏光特性の調査



偏光精度の向上

<< 観測システムの開発 >> CCDカメラ 連続撮影 回転波長板 回転角を2000Hzで取得



CCDカメラ





偏光精度 < 10⁻³を達成



偏光板自動回転装置

 望遠鏡に(I,Q,U,V)=(1,0,0,0)、(1,±1,0,0)、(1,0,±1,0)を 入射させる装置



観測 彩層上部で形成される スペクトル線 • 2010年5月3日 -波長: 連続光(Hel10830Å付近) - ターゲット: 太陽中心の静穏領域 理想的な無偏光光源 - 露出時間: 20、25、30 msec - 100枚連続撮影 天頂 - 波長分解能: 0.12Å/pix 太 陽 - 空間分解能: 0.6 arcsec/pix(420km/pix) Zd 観測者

- 10分おきに撮影 (太陽の位置を記録 Zdなど)



まとめ

- ・ 偏光分光データを用いた新しいプラズマ診断手法の開拓の
 ために高精度な偏光観測システムが必要
- DST偏光観測システムの開発
 - 偏光精度の向上
 - 波長板連続回転、連続撮像
 従来のものに比べ

SNの高い偏光観測が可能となった

- 幅広い波長に対応 3800~11000Å

- He 1083nmでのDST偏光特性を調べた
 - -X_N=0.976 X_C=0.997 δ_N=10.83° δ_C=357.53°
 -フィッティング精度が不十分なので、
 斜鏡以外のパラメーターを検討する必要がある
- 今後、DSTモデルの精度を高めると同時に
 3800~11000Åの範囲でDSTの偏光特性の調査